

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62586-2
Edition 1.0 2013-12

**POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER
SUPPLY SYSTEMS –**

**Part 2: Functional tests and uncertainty
requirements**

IEC 62586-2
Édition 1.0 2013-12

**MESURE DE LA QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION –**

**Partie 2: Essais fonctionnels et exigences
d'incertitude**

CORRIGENDUM 1

**Table 3 – Testing points for each
measured parameter**

Replace, in the row "Dips/Interruptions" and column "Testing point P1", for classes A and S, "Threshold dip-" by "Threshold dip+".

Replace, in the row "Dips/Interruptions" and column "Testing point P2", for class A and class S, "Threshold dip+" by "Threshold dip-".

6.4.1 General

In the existing table, in the row "A4.1.4" and column "Testing points according to Table 3", replace "P2 for Dips/Int." by "P3 for Dips/Int."

6.6.1 Measurement method

In the table, in the row "A6.1.6" and column "Target of the test", replace the existing text by:

"Check that a properly designed anti-aliasing filter is used on the device, providing (in combination with oversampling) an attenuation exceeding 50 dB for any frequency producing an alias below or up to the 50th harmonic."

7.12.3 Influence of temperature

In the table, in all the rows of the column

**Tableau 3 – Points d'essais pour
chaque paramètre mesuré**

Remplacer, dans la ligne "Creux, interruptions" et la colonne "Point d'essai P1", pour la classe A et classe S, "Creux-seuil" par "Creux+ seuil".

Remplacer, dans la ligne "Creux, interruptions" et la colonne "Point d'essai P2", pour la classe A et classe S, "Creux+ seuil" par "Creux- seuil".

6.4.1 Généralités

Dans le tableau existant, dans la ligne "A4.1.4" et la colonne "Points d'essai selon le Tableau 3", remplacer "P2 pour les Creux/Int." par "P3 pour les Creux/Int."

6.6.1 Méthode de mesure

Dans le tableau, dans la ligne "A6.1.6" et la colonne "Cible de l'essai", remplacer le texte existant par:

"Vérifiez qu'un filtre anti-repliement correctement conçu est utilisé sur l'appareil, en fournissant (en combinaison avec suréchantillonnage) une atténuation dépassant 50 dB de toutes les fréquences produisant un alias au-dessous ou jusqu'à la 50ème harmonique."

7.12.3 Influence de la température

Dans le tableau, dans toutes les lignes de

“Test criterion (if test is applicable)”,
replace “TC10s(ue)” by:

For “Clock uncertainty (check drift on a 8 h duration)”: Less than 333 ms.

For other tests on frequency:
Measurement value will be used for further calculation. Check each 10 s measurement complies with the limits (e.g. Figure 2 of IEC 62586-1).

For other tests on voltage magnitude:
Check each 10/12 cycles measurement complies with the limits.

7.12.4 Influence of power supply voltage

In the table, in all the rows of the column “Test criterion (if test is applicable)” replace “TC10s(ue)” by:

For tests on frequency: Measurement value will be used for further calculation. Check each 10 s measurement complies with the limits.

For tests on voltage magnitude: Measurement value will be used for further calculation. Check each 10/12 cycles measurement complies with the limits.

E.3.2 Result evaluation

Replace the existing equation:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{RMS}(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

by:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{RMS}(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$

E.4.2 Result evaluation

Replace the existing equation:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

by:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$

la colonne “Critère d'essai (si l'essai s'applique)”, remplacer “TC10s(ue)” par:

Pour “Incertitude d'horloge (vérifiez la dérive sur une durée de 8 h)”: Moins de 333 ms.

Pour d'autres essais sur la fréquence: Valeur de mesure sera utilisée pour d'autres calculs. Vérifiez que chaque mesure de 10 s est conforme aux limites (par exemple Figure 2 de la IEC 62586-1)

Pour d'autres essais pour l'amplitude de tension: Vérifiez que chaque mesure de 10/12 cycles est conforme aux limites.

7.12.4 Influence de la tension d'alimentation

Dans le tableau, dans toutes les lignes de la colonne “Critère d'essai (si l'essai s'applique)”, remplacer “TC10s(ue)” par:

Pour des essais sur la fréquence: Valeur de mesure sera utilisée pour d'autres calculs. Vérifiez que chaque mesure de 10 s est conforme aux limites.

Pour des essais sur l'amplitude de tension: Valeur de mesure sera utilisée pour d'autres calculs. Vérifiez que chaque mesure de 10/12 cycles est conforme aux limites.

E.3.2 Évaluation du résultat

Remplacer l'équation existante:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{RMS}(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

par:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{RMS}(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$

E.4.2 Évaluation du résultat

Remplacer l'équation existante:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

par:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$